

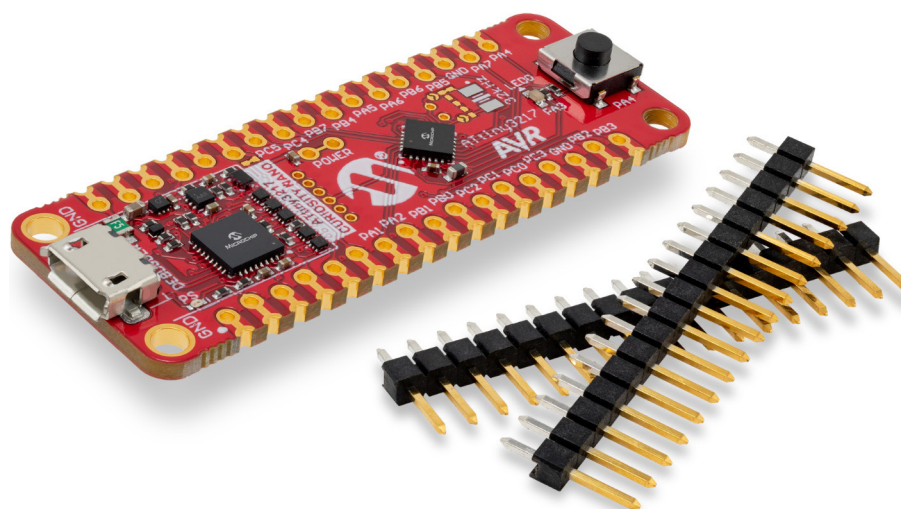
## ATtiny3217 Curiosity Nano ハードウェア使用者の手引き

### 序文

ATtiny3217 Curiosity Nano評価キットはtinyAVR® 1系列のマイクロ コントローラを評価するためのハードウェア基盤です。この基板は実装されたATtiny3217マイクロ コントローラ(MCU)を持ちます。

Atmel Studio/Microchip MPLAB® X統合開発環境によって支援され、この基板は独自設計デバイス統合する方法を説明するため、ATtiny3217の機能への容易なアクセスを提供します。

Curiosity Nano系列の評価キットは基板上デバグを含みます。ATtiny3217を書いてデバグするのに外部ツールがありません。



- [MPLAB® X IDE](#)と[Atmel Studio](#) – Microchipマイクロ コントローラを見つけて構成設定して開発し、書き込んでデバグするためのソフトウェア。
- [ATtiny3217ウェブサイト](#) – 資料、データシート、見本の発見とマイクロ コントローラの購入。
- [ATtiny3217 Curiosity Nanoウェブサイト](#) – キット情報、最新の使用者の手引き、設計資料。

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Microchip社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめに]での内容にご注意ください。

## 目次

序文 .....	1	7.5. IARでの開始に際して .....	24
1. 序説 .....	3	Microchipウェブ サイト .....	25
1.1. 特徴 .....	3	製品変更通知サービス .....	25
1.2. キット概要 .....	3	お客様支援 .....	25
2. 開始に際して .....	3	Microchipデバイス コード保護機能 .....	25
2.1. 即時開始 .....	3	法的通知 .....	25
2.2. 設計資料と関連リンク .....	4	商標 .....	26
3. Curiosity Nano .....	4	品質管理システム .....	26
3.1. 基板上デバッグ概要 .....	4	世界的な販売とサービス .....	27
3.1.1. デバッグ .....	5		
3.1.2. 仮想シリアル ポート (CDC) .....	5		
3.1.2.1. 概要 .....	5		
3.1.2.2. オペレーティング システム支援 .....	5		
3.1.2.3. 制限 .....	5		
3.1.2.4. 合図 .....	6		
3.1.2.5. 高度な使い方 .....	6		
3.1.3. 大容量記憶装置 .....	6		
3.1.3.1. 大容量記憶装置実装 .....	6		
3.1.3.2. ヒューズ バイト .....	7		
3.1.3.3. ドラッグ&ドロップ書き込みの制限 .....	7		
3.1.3.4. 特殊命令 .....	7		
3.1.4. データ交換器インターフェース (DGI) .....	8		
3.1.4.1. デバッグGPIO .....	8		
3.1.4.2. 時刻印 .....	8		
3.2. Curiosity Nano標準ピン配列 .....	9		
3.3. 電源 .....	9		
3.3.1. 目的対象調整器 .....	9		
3.3.2. 外部供給 .....	10		
3.3.3. VBUS出力ピン .....	11		
3.3.4. 電源特例 .....	11		
3.4. 低電力測定 .....	12		
3.5. 外部マイクロコントローラ書き込み .....	12		
3.5.1. 支援デバイス .....	12		
3.5.2. ソフトウェア構成設定 .....	12		
3.5.3. ハードウェア変更 .....	13		
3.5.4. 外部マイクロコントローラへの接続 .....	13		
3.6. 外部デバッグ接続 .....	14		
4. ハードウェア使用者の手引き .....	16		
4.1. コネクタ .....	16		
4.1.1. ATtiny3217 Curiosity Nanoピン配列 .....	16		
4.1.2. ピン ヘッダの使い方 .....	16		
4.2. 周辺機能 .....	16		
4.2.1. LED .....	16		
4.2.2. 機械的な切替器 .....	16		
4.2.3. クリスタル .....	17		
4.2.4. 基板上デバッグ実装 .....	17		
4.2.4.1. 基板上デバッグ接続 .....	17		
5. ハードウェア改訂履歴と既知の問題 .....	18		
5.1. 製品IDと改訂の識別 .....	18		
5.2. 改訂2 .....	18		
6. 文書改訂履歴 .....	18		
7. 追補 .....	19		
7.1. 回路図 .....	19		
7.2. 組立図 .....	21		
7.3. Click boards™用Curiosity Nano Base .....	22		
7.4. 基板上デバッグ切断 .....	23		



## 2.2. 設計資料と関連リンク

以下の一覧はATtiny3217 Curiosity Nano基板に最も関連する資料とソフトウェアへのリンクを含みます。

- **MPLAB® X IDE** – MPLAB® X IDEはMicrochipマイクロ コントローラとデジタル信号制御器用応用を開発するためのPC(Windows®, Max OS®, Linux®)で動くソフトウェア プログラムです。これは組み込みマイクロ コントローラ用コードを開発するための統合された単一”環境”を提供するため、統合開発環境(IDE: Integrated Development Environment)と呼ばれます。
- **Atmel Studio** – マイクロ コントローラ用のC/C++とアセンブリ コードの開発用無料IDE
- **AVR®用IAR Embedded Workbench®** – これはAVRマイクロ コントローラに利用可能な商用C/C++コンパイラです。30日評価版だけでなくそれらのウェブサイトから入手可能な4Kバイト コード量制限始動版もあります。
- **MPLAB®コード構成部** – MPLABコード構成部(MCC: Microchip Code Configurator)はあなたの応用に特化した周辺機能と関数を構成設定するための図画的インターフェースを提供する無料のソフトウェア プラグインです。
- **Atmel START** – Atmel STARTは使い易く最適化された規則でソフトウェア構成部品を選んで構成設定してあなたの組み込み応用を眺えて使用者を助けるオンライン ツールです。
- **Microchip試供品店** – デバイスの試供品を注文することができるMicrochip試供品店です。
- **MPLAB Data Visualizer** – MPLABデータ可視器(Data Visualizer)はデータを処理して可視化するのに使われるプログラムです。データ可視器はCuriosity NanoとXplained Proの基板で見つかるようなシリアル ポートと基板上デバッグのデータ交換器インターフェースのような様々な供給元からデータを受け取ることができます。
- **Studio Data Visualizer** – Studioデータ可視器(Data Visualizer)はデータを処理して可視化するのに使われるプログラムです。データ可視器はCuriosity NanoとXplained Proの基板で見つかるようなシリアル ポートと基板上デバッグのデータ交換器インターフェースのような様々な供給元からのデータとPowerデバッグからの電力データを受け取ることができます。
- **Microchip PIC®とAVR®の例** – MicrochipのPICとAVRデバイス例はPICとAVRデバイスの周辺機能の使い方を披露するためにMicrochip開発基板を使う例と実験室の集合です。
- **Microchip PIC®とAVR®の解決策** – MicrochipのPICとAVRデバイス解決策は適応され拡張される準備が整ったMicrochip開発基板で使うための完全な応用を含みます。
- **ATtiny3217 Curiosity Nanoウェブサイト** – キット情報、最新使用者の手引き、設計資料
- **Microchip直販でのATtiny3217 Curiosity Nano** – Microchip直販でこのキットを購入

## 3. Curiosity Nano

Curiosity Nanoはマイクロ コントローラの入出力の殆どへのアクセスを持つ小さな基板の評価基盤です。この基盤は基板上デバッグを持つ少ピン数マイクロ コントローラ(MCU)の系列から成り、Atmel Studio/Microchip MPLAB® Xと統合されます。接続時、関連使用者の手引き、応用記述、データシート、コード例を含む鍵となる資料へのリンクでキット ウィンドウが表示されます。見つけるのが全て容易です。基板上デバッグはホストPCとのシリアル通信の仮想シリアル ポート(CDC)とデバッグ汎用入出力(GPIO)ピンでのデータ中継器インターフェース(DGI: Data Gateway Interface)が特徴です。

### 3.1. 基板上デバッグ概要

ATtiny3217 Curiosity Nanoは書き込みとデバッグ用の基板上デバッグを含みます。基板上デバッグは以下のいくつかのインターフェースから成る複合USB装置です。

- Atmel Studio/Microchip MPLAB® X IDEでATtiny3217の書き込みとデバッグをすることができるデバッグ
- ATtiny3217のドラッグ&ドロップ書き込みを許す大容量記憶装置
- ATtiny3217の万能非同期送受信器(UART)に接続され、端末ソフトウェアを通して目的対象応用と通信する容易な方法を提供する仮想シリアル ポート(CDC)
- プログラムの流れを可視化するための論理分析部チャネル(デバッグGPIO)でのコード計装用データ中継器インターフェース(DGI)

基板上デバッグはATtiny3217 Curiosity Nano基板上の(PSと記された)電力と状態のLEDを制御します。下表は各種動作形態でLEDがどう制御されるかを示します。

表3-1. 基板上デバッグLED制御

動作形態	電力と状態のLED
ブートロータ動作	電源投入の間、LEDが低速点滅
電源投入	LEDがON
標準動作	LEDがON
書き込み	活動表示部: 書き込み/デバッグの間、LEDが低速点滅
ドラッグ&ドロップ書き込み	成功: LEDが2秒間低速点滅 失敗: LEDが2秒間高速点滅
障害	電力障害が検出された場合にLEDが高速点滅
休止/OFF	LEDがOFF。基板上デバッグは休止動作か電力断のどちらか。これはキットが外部給電される場合に起き得ます。





**情報:** 低速点滅は概ね1Hzで、高速点滅は概ね5Hzです。

### 3.1.1. デバッグ

ATtiny3217 Curiosity Nanoの基板上デバッグはホスト コンピュータのUSBサブシステムで人インターフェース装置(HID:Human Interface Device)として現れます。このデバッグはAtmel Studio/Microchip MPLAB® X IDEだけでなくいくつかの第三者IDEを使ってもATtiny3217の完全な機能の書き込みとデバッグを支援します。



**留意:** デバッグのファームウェアを最新に保ってください。ファームウェア更新はAtmel Studio/Microchip MPLAB® X IDE使用時に自動的に行われます。

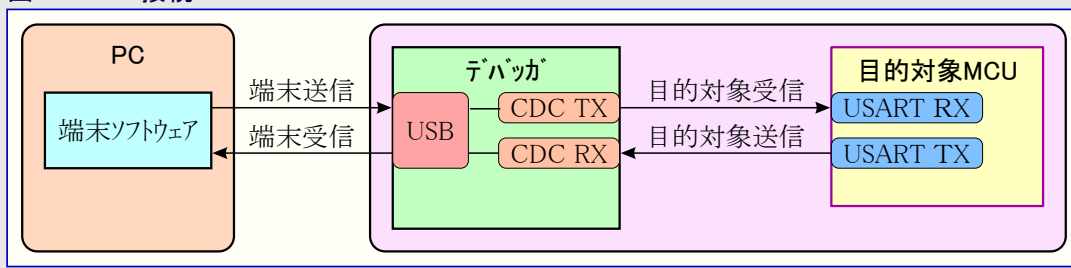
### 3.1.2. 仮想シリアル ポート (CDC)

仮想シリアル ポート(CDC)はホストPCと目的対象デバイス間の汎用シリアル橋渡しです。

#### 3.1.2.1. 概要

基板上デバッグはホストで仮想シリアル ポートとして現れる標準通信装置クラス(CDC:Communications Device Class)を含む複合USB装置を実装します。CDCはホスト コンピュータと目的対象間の両方向で任意データを流すのに使うことができます。ホスト コンピュータで仮想シリアル ポートを通して送られた全ての文字はデバッグのCDC TXピンでUARTとして送られ、デバッグのCDC RXピンで捕獲されたUART文字は仮想シリアル ポートを通してホスト コンピュータに返されます。

図3-1. CDC接続



**情報:** 図3-1.で示されるように、ホスト コンピュータから受け取る文字に対してデバッグのCDC TXピンは目的対象のUSART RXピンに接続されます。同様に、ホスト コンピュータへ送られる文字に対してデバッグのCDC RXピンは目的対象のUSART TXピンに接続されます。

#### 3.1.2.2. オペレーティング システム支援

Windows機ではCDCがCuriosity Virtual COM Port(Curiosity仮想COMポート)として列挙(接続認識)され、Windowsデバイス マネージャのポート部分に現れます。COMポート番号はそこで見つけることもできます。



**情報:** 古いWindowsシステムではCDCに対してUSBドライバが必要とされます。このドライバはAtmel Studio/MPLAB® X IDEのインストールに含まれます。

Linux機ではCDCが/dev/ttyACM#として列挙(接続認識)されて現れます。



**情報:** Linuxでtty\*装置は”dialout”群に属し、故にCDCアクセスする許可を持つ群の一員になることが必要かもしれません。

MAC機ではCDCが/dev/tty.usbmodem#として列挙(接続認識)されて現れます。どの端末プログラムが使われるかに依存して、usbmodem#として利用可能なモデムの一覧で現れます。



**情報:** 全てのオペレーティング システムに対して：DTR信号を支援する端末模倣部を使うことに注意してください。「3.1.2.4. 合図」をご覧ください。

#### 3.1.2.3. 制限

基板上デバッグのCDCで全てのUART機能が実装される訳ではありません。制限は以下のようにここで概説されます。

- ・ **ボーレート:** 1200bps～500kbpsの範囲でなければなりません。この範囲外のどのボーレートも警告なしに最も近い限度に設定されます。ボーレートは実行中に変えることができます。
- ・ **文字形式:** 8ビット文字だけが支援されます。
- ・ **パリティ:** 奇数、偶数、なしにすることができます。
- ・ **ハードウェア流れ制御:** 支援なし
- ・ **停止ビット:** 1または2のビットが支援されます。


## 3.1.2.4. 合図

USB列挙(接続認識)の間、ホストOSはCDCインターフェースの通信とデータの両パイプを開始します。この時点で、CDCのボーレートと他のUARTパラメータを設定して読み戻すことが可能ですが、データの送付と受け取りは許可されません。

ホストで端末が接続される時にDTR信号が活性にされなければなりません。これがUSBインターフェースで実装される仮想制御信号のため、基板には物理的に存在しません。ホストからのDTR活性化は基板上デバッグにCDC作業が活性であることを示します。デバッグは(利用可能ならば)その水準移動器(レベルシフト)を許可してCDCデータの送受信機構を開始します。

DTR信号の不活性化は水準移動器を禁止しませんが、受信部を禁止し、故に更なるデータはホストへ流されません。目的対象へ送るため既に待ち行列化されたデータパケットは送付を続けますが、更なるデータは全く受け入れられません。

 **留意:** 端末模倣部をDTR信号有効に設定してください。その信号なしでは基板上デバッグがそのUARTを通すデータの送付も受信もしません。

 **助言:** 基板上デバッグのCDC TXピンはホストによってCDCインターフェースが許可されるまで駆動されません。また、デバッグと目的対象に接続しているCDC線上に外部プルアップ抵抗がなく、これは電源投入中にそれらの線が浮いていることを意味します。フレーミング異常などのような予測不能な動きに帰着するどんな不具合も避けるため、目的対象デバイスはデバッグのCDC TX線に接続されたピンで内部プルアップを許可すべきです。

## 3.1.2.5. 高度な使い方

### CDC置き換え動作

標準動作では、基板上デバッグはホストとデバイス間の真のUART橋渡しです。けれども、或る使用事例で、基板上デバッグは基本動作形態を置き換えて他の目的のためにCDC TXとRXのピンを使うことができます。

デバッグのCDC TXピンの出力に文字を送るのに、基板上デバッグの大容量記憶ドライブへの文書ファイル引き摺りを使うことができます。ファイル名と拡張子は普通ですが、文書ファイルは次のような文字で始まらなければなりません。

**CMD:SEND\_UART=**

最大メッセージ長は50文字で、フレーム内の全ての残りデータは無視されます。

この動作で使われる既定ボーレートは9600bpsですが、CDCが既に活性、または構成設定されていた場合、以前に使われたボーレートが未だ適用されます。

### USB段階のフレームの考慮

ホストからCDCへ送るデータはバイト単位、または64バイトUSBフレーム内に切り分けられる塊で行うことができます。このような各々のフレームはデバッグのCDC TXピンへ送るため、待ち行列にされます。フレーム毎に少量のデータを転送すると、基板上デバッグがバイトではなくフレームを緩衝するため、特に低ボーレートで非効率になり得ます。最大4つの64バイトフレームを何時でも活性にすることができます。基板上デバッグはそれによってやって来るフレームを調整します。データを含む完全な64バイトフレームの送付が最も効率的な方法です。

デバッグのCDC RXピンでデータを受け取る時に、基板上デバッグはやって来るバイトを64バイトフレームへ一列に並べ、それらが満たされた時にホストへ送るためにUSB待ち行列に送られます。不完全なフレームも概ね100ms間隔でUSB待ち行列へ押し込まれ、USBフレーム開始通票によって起動されます。何時でも最大8つの64バイトフレームを活性にすることができます。

ホスト(またはそれ上で走行しているソフトウェア)が充分速くデータを受け取ることに失敗した場合、オーバーランが発生します。これが起きると、USB待ち行列に送られつつあるものに代わって最後に満たされた緩衝部フレームが再使用され、完全なフレームデータが失われます。この発生を防ぐため、使用者はCDCデータパイプが継続的に読まれることを保証するか、またはやって来るデータ速度が減らされなければなりません。

## 3.1.3. 大容量記憶装置

基板上デバッグはそれが接続されるホストオペレーティングシステム経由で読み書き操作に対してアクセスができる簡単な大容量記憶装置実装を含みます、

これは以下を提供します。

- キットの情報と支援を詳述するための基本的な文書とHTMLのファイルに対する読み込みアクセス
- Intel® HEX形式ファイルを目的対象デバイスのメモリに書くための書き込みアクセス
- 有用な目的用の簡単な文書ファイルのための書き込みアクセス

### 3.1.3.1. 大容量記憶装置実装

基板上デバッグは部分的にFAT12それ自身の特質とそれの組み込み応用に対する目的を満たすための最適化のため、いくつかの制限を持ち高く最適化されたFAT12ファイルシステムの変種を実装します。

Curiosity Nano USB装置は大容量記憶装置としてUSB第9節適合ですが、汎用大容量記憶装置で期待するものを多少なりとも満たしません。この動きは意図的です。

Windowsオペレーティングシステム使用時、基板上デバッグはデバイスマネージャのディスク部分で見つけることができるCuriosity Nano USB装置として列挙(認識)されます。CURIOSITYドライブはファイルマネージャに現れ、システムで次に利用可能なドライブ文字を獲得します。


CURIOSITYドライブは概ね1Mバイトの空き空間を含みます。これは決して目的対象デバイスのフラッシュメモリの大きさを反映しません。Intel® HEXファイル書き込み時、大きな付随負荷を与える付加データを持つASCIIで符号化され、故に1Mバイトはディスクの大きさ用に適当に選ばれた値です。

CURIOSITYドライブをフォーマットすることは不能です。目的対象へのファイル書き込み時、ファイル名がディスクディレクトリ一覧に現れるかもしれませんが。これは単にオペレーティングシステムのディレクトリ表示にすぎず、現実には更新されません。そのファイル内容を読み出すことは不可能です。基板を取り外して再接続すると、ファイルシステムをその元の状態に戻しますが、目的対象は未だ直前に書かれた応用を含みます。

目的対象デバイスを消去するにはディスクに”CMD:ERASE”で始まる文字ファイルを複写してください。

既定でCURIOSITYドライブはアイコン生成だけでなく、状態と更なる情報へのリンクを報告するための以下のようないくつかの読み込み専用ファイルを含みます。

- **AUTORUN.ICO** – Microchipロゴ用アイコンファイル
- **AUTORUN.INF** – アイコンファイルを表示するためにWindowsのエクスプローラに対して必要とされるシステムファイル
- **KIT-INFO.HTM** – 開発基板ウェブサイトへの向け直し
- **KIT-INFO.TXT** – 基板のデバッグファームウェア版、基板名、USB通番、デバイス、ドラッグ&ドロップ支援についての詳細を含む文字ファイル
- **STATUS.TXT** – 基板の書き込み状態を含む文字ファイル

 **情報:** STATUS.TXTが基板上デバッグによって動的に更新されます。その内容はOSによってキャッシュされ、従って、正しい状態を反映しないかもしれません。

### 3.1.3.2. ヒューズ・バイト

ヒューズ・バイト (AVR® MCU目的対象)

ドラッグ&ドロップ書き込みを行う時に、デバッグは統一プログラム/デバッグインターフェース(UPDI:Unified Program and Debug Interface)を禁止しようとするヒューズ・ビットを遮蔽します。これはそのリセットまたはGPIO動作でUPDIを使うことができないことを意味し、UPDIピンでの代替機能の1つを選ぶと、高電圧UPDI有効化能力がある外部デバッグを使うことを除き、デバイスをアクセス不能にします。

### 3.1.3.3. ドラッグ&ドロップ書き込みの制限

施錠ビット

Hexファイルに含まれる施錠ビットはドラッグ&ドロップ書き込みを使う時に無視されます。施錠ビットを書くにはAtmel Studio/MPLAB® X IDEを使ってください。

ヒューズでのCRC検査許可

ドラッグ&ドロップ書き込みを使う時にデバイスのヒューズでCRC検査を許可することはお勧めできません。これは(ヒューズ・ビットに影響を及ぼさない)後続するチップ消去がCRC不整合をもたらし、応用が起動に失敗するからです。この状態から目的対象を回復するにはAtmel Studio/MPLAB® X IDEを使ってチップ消去が行われなければならない、これは消去後、自動的にCRCヒューズを解消します。

### 3.1.3.4. 特殊命令

大容量記憶装置への文字ファイル複写によっていくつかの有用な命令が支援されます。ファイル名と拡張子は無関係で、命令処理部は内容だけに反応します。

表3-2. 特殊ファイル命令

命令内容	説明
CMD:ERASE	目的対象のチップ消去を実行
CMD:SEND_UART=	CDC UARTに文字列を送信。「 <a href="#">CDC置き換え動作</a> 」をご覧ください。
CMD:RESET	書き込み動作へ入ってその後直ちに書き込み動作を抜け出すことによって目的対象をリセット。正確なタイミングは目的対象デバイスの書き込みインターフェースに従って変わり得ます。(デバッグファームウェア1.16版またはより新しい版)
CMD:POWERTOGGLE	目的対象の電力を切り、100ms遅れ後に電力を回復。外部電源が供給される場合、これは無効です。(デバッグファームウェア1.16版またはより新しい版)
CMD:0V	目的対象供給調整器を禁止することによって目的対象デバイスの電力を断。外部電源が供給される場合、これは無効です。(デバッグファームウェア1.16版またはより新しい版)
CMD:3V3	目的対象電圧を3.3Vに設定。外部電源が供給される場合、これは無効です。(デバッグファームウェア1.16版またはより新しい版)
CMD:5V0	目的対象電圧を5.0Vに設定。外部電源が供給される場合、これは無効です。(デバッグファームウェア1.16版またはより新しい版)



**情報:** この命令一覧は大容量記憶模倣ディスクに送られつつある内容によって起動され、成功と失敗のどちらの場合も反応は提供されません。

### 3.1.4. データ中継器インターフェース (DGI)

データ中継器インターフェース(DGI:Data Gateway Interface)は基板上デバッグとホスト コンピュータに基づく可視化ツール間で生と時刻印されたデータを転送するためのUSBインターフェースです。ホスト コンピュータでデバッグGPIOデータを表示するのにMPLAB Data Visualizer(データ可視器)が使われます。これはMPLAB® X IDE用プラグインまたはAtmel Studio/MPLAB® X IDEと並行して使うことができる独立型応用として利用可能です。

DGIがいくつかの物理的なデータ インターフェースを包含するとは言え、ATtiny3217 Curiosity Nano実装は次のような論理回路分析部チャネルを含みます。

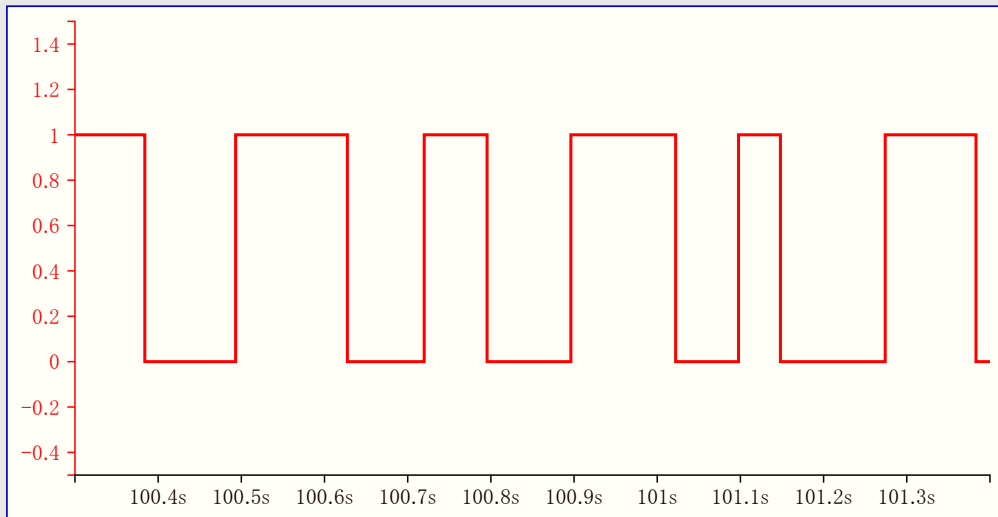
- (DGI GPIOとしても知られる)2つのデバッグGPIOチャネル

#### 3.1.4.1. デバッグGPIO

デバッグGPIOチャネルは目的対象応用をホスト コンピュータ可視化応用に接続する時刻印されたデジタル信号線です。これらは代表的に時間軸での低周波数事象の発生、例えば、或る応用状態遷移が起きた時を作図するのに使われます。

下図はMPLABデータ可視器(Data Visualizer)でデバッグGPIOに接続された機械的な切替器のデジタル状態の監視を示します。

図3-2. MPLAB®データ可視器でのデバッグGPIO監視



デバッグGPIOチャネルは時刻印され、故にDGI GPIO事象の分解能はDGI時刻印単位部の分解能によって決められます。



**重要:** より高い周波数信号の集中を捕獲することができても、GPIOが使える有用な信号の周波数範囲は最大約2kHzです。この周波数を超える信号を捕獲する試みはデータの飽和と溢れに帰着し、DGI作業を中断させるかもしれません。

#### 3.1.4.2. 時刻印

DGI供給元はそれらがデバッグによって捕獲されるため時刻印されます。Curiosity Nanoデバッグで実装される時刻印計数器は0.5μsの時刻印分解能を提供する2MHzの周波数で増されます。



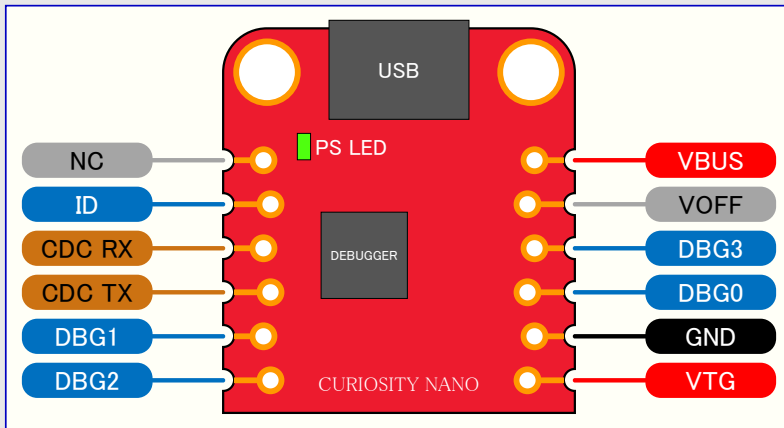
## 3.2. Curiosity Nano標準ピン配列

Curiosity Nano基板上のUSBコネクタに最も近い12端子の端コネクタは標準化されたピン配列を持ちます。書き込み/デバッグピンは下の表と図で示されるように目的対象インターフェースに依存して異なる機能を持ちます。

表3-3. Curiosity Nano標準ピン配列

デバッグ信号	目的対象MCU	説明
ID	-	拡張用ID線
CDC TX	UART RX	USB CDC TX線
CDC RX	UART TX	USB CDC RX線
DBG0	UPDI	デバッグデータ線
DBG1	GPIO1	デバッグGPIO1
DBG2	GPIO0	デバッグGPIO0
DBG3	RESET	リセット線
N.C.	-	接続なし
VBUS	-	外部使い用VBUS電圧
VOFF	-	電圧OFF入力。Lowに引かれる時に目的対象調整器と目的対象電圧を禁止
VTG	-	目的対象電圧
GND	-	共通接地

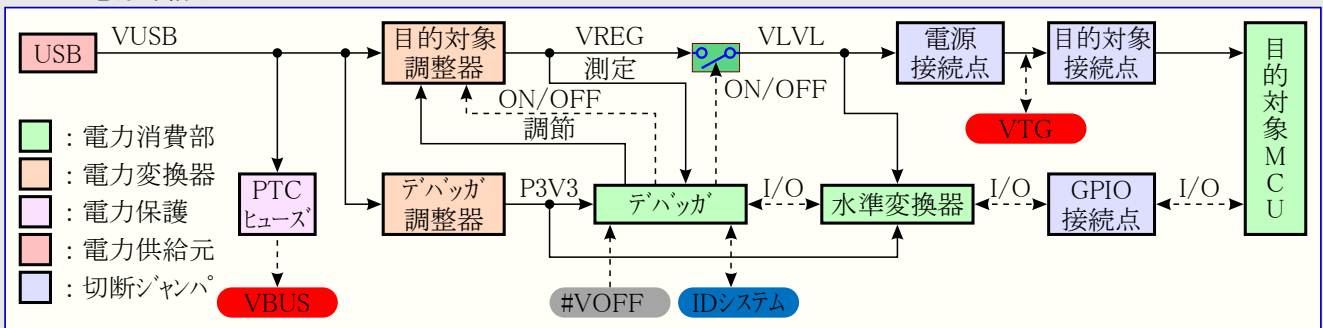
図3-3. Curiosity Nano標準ピン配列



## 3.3. 電源

基板はUSBポートを通して給電され、基板上デバッグ用の3.3Vを生成するための1つと目的対象ATtiny3217マイクロコントローラとその周辺機能用の調節可能なLDO調整器の2つの調整器を含みます。USBコネクタからの電圧は(USB仕様に従って)4.4~5.25V間で変わるかもしれませんが、目的対象への最大電圧を制限します。下図はATtiny3217 Curiosity Nano上の電源システム全体を示します。

図3-4. 電源部構成図



### 3.3.1. 目的対象調整器

目的対象電圧調整器はMIC5353可変出力LDOです。基板上デバッグはMIC5353の帰還電圧を操作することによって基板目的対象部分へ供給する電圧出力を調節することができます。このハードウェア実装は概ね1.7~5.1Vの電圧範囲に制限されます。出力電圧がATtiny3217マイクロコントローラのハードウェア限度を決して超えないことを保証するためにデバッグファームウェアで付加的な出力電圧制限が構成設定されます。ATtiny3217 Curiosity Nanoの基板上デバッグで構成設定される電圧制限は1.8~5.5Vです。

**情報:** 目的対象電圧は基板が製造される時に3.3Vに設定されます。これはMPLAB X IDEプロジェクト プロパティとAtmel Studioデバース プログラミング ダイアログを通して変更することができます。例え電力OFF/ONを通して、目的対象電圧へのどの変更も持続します。分解能は5mVですが、調整プログラムによって10mVに制限されるかもしれません。

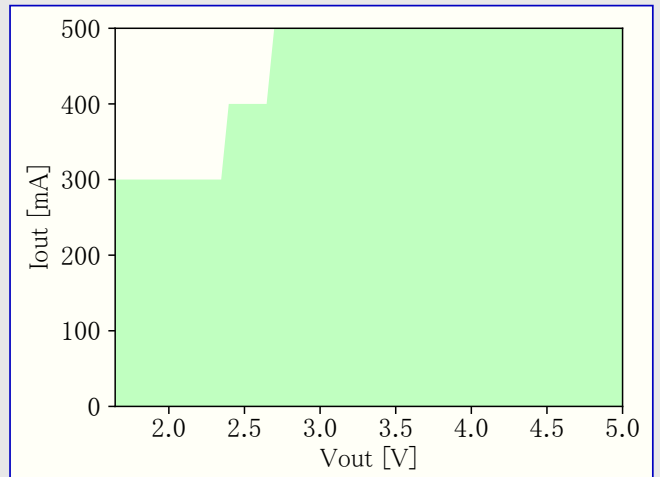
**情報:** Atmel Studio/MPLAB® X IDEで設定される電圧設定は直ちに基板へ提供されません。新しい電圧設定はプロジェクト操作盤タブで**Refresh Debug Tool Status**(デバッグ ツール状態更新)釦押下またはプログラム メモリ読み書きのような何れかの方法でデバッグがアクセスされる時に基板へ適用されます。

**情報:** 命令文字ファイルの基板へのドラッグ&ドロップで目的対象電圧を調整する簡単な任意選択があります。これは0.0V、3.3V、5.5Vの設定だけを支援します。更なる詳細については「[3.1.3.4. 特殊命令](#)」項をご覧ください。

MIC5353は500mAの最大電流負荷を支援します。これは小さな印刷回路基板(PCB)上に配置された小さな外囲器のLDO調整器で、500 mAより低い負荷で温度遮断条件に達するかもしれません。最大電流負荷は入力電圧、選んだ出力電圧、周囲温度に依存します。右図は5.1Vの入力電圧と23°Cの周囲温度での調整器に対する安全動作領域を示します。

目的対象調整器の電圧出力は基板上デバッグによって継続的に監視(測定)されます。これが電圧設定値の上下100mVよりも大きい場合、異常状態が合図され、目的対象電圧調整器はOFFにされます。これはどの短絡回路状態も検出して処理します。VOFFピンのLow設定なしにVCC\_TARGETを電圧設定監視窓の±100mVの外に移動させる外部電圧がVTGピンに急に印加された場合も検出して処理します。

図3-5. 目的対象調整器安全動作領域



**情報:** 外部電圧が監視窓下限(目的対象電圧設定-100mV)よりも低い場合、基板上デバッグ状態LEDが高速点滅します。外部電圧が監視窓上限(目的対象電圧設定+100mV)よりも高い場合、基板上デバッグ状態LEDは点灯を続けます。外部電圧が取り去られた場合、状態LEDは基板上デバッグが新しい状況を検出して目的対象電圧調整器をONに戻すまで高速点滅を開始します。

### 3.3.2. 外部供給

ATtiny3217 Curiosity Nanoは基板上の目的対象調整器の代わりに外部電圧によって給電することができます。電圧OFF(VOFF)ピンが接地(GND)に短絡されると、基板上デバッグ ファームウェアは目的対象調整器を禁止し、VTGピンに外部電圧を印加しても安全です。

USBケーブルが基板上の**DEBUG**コネクタに接続されていない時にVTGピンに外部電圧を印加しても安全です。

VOFFピンは何時でもLowになる/することができます。これは基板上デバッグに対するピン変化割り込みによって検出され、それによって目的対象電圧調整器を制御します。

**警告** GNDへのVOFF短絡なしでのVTGピンへの外部電圧印加は基板を恒久的な損傷にさせるかもしれません。

**警告** VOFFピンへどんな電圧も印加しないでください。電源を許可するにはこのピンを浮かせてください。

**警告** 基板上の水準変換器に対する絶対最大外部電圧は5.5Vで、ATtiny3217の標準動作条件は1.8~5.5Vです。より高い電圧の印加は基板を恒久的な損傷にさせるかもしれません。

**情報:** VOFFピンをLowに引くことなく外部電圧が印加され、外部供給が監視窓下限(目的対象電圧設定-100mV)よりも低い電圧に引っ張る場合、基板上デバッグ状態LEDが高速点滅して基板上調整器を停止します。VOFFピンがLowに引かれていない時に外部電圧が急に取り去られた場合、状態LEDは基板上デバッグが新しい状況を検出して目的対象電圧調整器をONに戻すまで高速点滅を開始します。

書き込み、デバッグ、データ流しは外部電源で未だ可能で、デバッグと信号水準変換器はUSBケーブルから給電されます。両調整器、デバッグ、水準変換器はUSBケーブルが取り去られると電力断にされます。

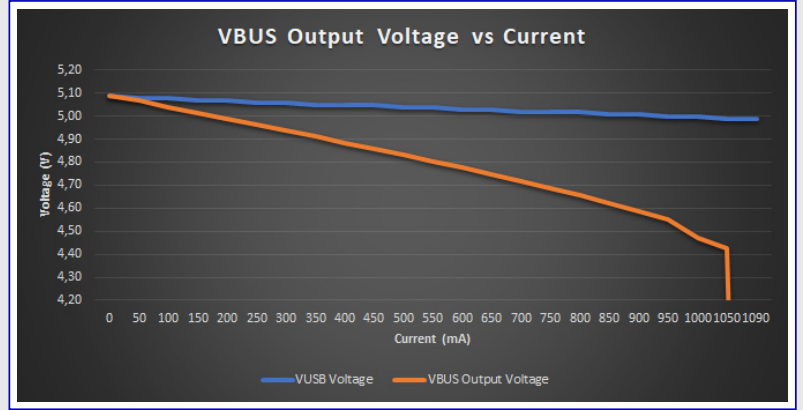


**情報:** ATtiny3217とそれの周辺機能によって消費される電力に加えて、USBケーブルが基板上の**DEBUG**コネクタに接続される時に基板上水準変換器と電圧監視回路に給電するためにどの外部電源からも概ね100μAが引き出されます。USBケーブルが接続されないと、水準変換器電圧ピンに供給するために多少の電流が使われ、これは概ね5μAの最悪消費電流を持ちます。代表的な値は100nA位の低さでしょう。

### 3.3.3. VBUS出力ピン

ATtiny3217 Curiosity Nanoは5V供給が必要な外部部品に給電するのに使うことができるVBUS出力ピンを持ちます。VBUS出力ピンは回路短絡に対してUSBを保護するためにPTCヒューズを持ちます。PTCヒューズの副作用はより高い電流負荷でのVBUS出力での電圧降下です。右図は電圧対VBUS出力の電流負荷を示します。

図3-6. VBUS出力電圧対電流



### 3.3.4. 電源特例

これは電源で起き得る殆どの特例の要約です。

#### 目的対象電圧切断

これは目的対象部分が与えられた電圧で多すぎる電流を引き出す場合に起き得ます。これはMIC5353調整器の過熱保護安全機能を起動させます。これを避けるには目的対象部分の電流負荷を減らしてください。

#### 目的対象電圧設定不到達

最大出力電圧は(4.4~5.25V間で指定される)USB入力電圧、与えられた電圧設定と消費電流に於いてMIC5353調整器を渡る電圧降下によって制限されます。より高い出力電圧が必要とされる場合、より高い入力電圧を提供することができるUSB電源を使うか、またはVTGPピンで外部電源を使ってください。

#### 目的対象電圧が設定と違う

これはVOFFピンをLowに設定することなく、VTGPピンへ外部的に電圧を印加することによって起き得ます。目的対象電圧が電圧設定の上下100mVよりも大きく異なる場合、基板上デバッグによってそれが検出され、内部電圧調整器が停止されます。この問題を修正するにはVTGPピンから印加した電圧を取り去ってください。基板上デバッグは新しい状況が検出されると、基板上調整器を許可します。目的対象電圧が設定の100mV未満の場合に**PS** LEDが高速点滅しますが、設定の100mV越えより高い時に通常点灯することに注意してください。

#### 非常に低い目的対象電圧またはなしでPS LEDが高速点滅

これは完全または部分的な短絡回路によって起き得て、実際には上で言及した問題の特別な場合です。短絡回路を取り除いてください。基板上デバッグが基板上目的対象電圧調整器を再許可するでしょう。

#### 目的対象電圧なしでPS LEDが点灯1

これは目的対象電圧が0.0Vに設定される場合に起きます。これを修正するには目的対象電圧を目的対象デバイスに対して指定された電圧範囲内の値に設定してください。

#### 目的対象電圧なしでPS LEDが点灯2

これは**J100**や**J101**の電力ジャンパが切断され、目的対象電圧調整器が目的対象デバイスに対して指定された電圧範囲内の値に設定されている場合に問題になり得ます。これを修正するには**J100**/**J101**用パッド間を線/橋渡しで半田付けするか、またはピンヘッダが実装されているなら**J101**にジャンパを追加してください。

#### VBUS出力電圧が低いまたは存在しない

これはほぼ明らかにVBUSでの高電流引き出しによって引き起こされ、保護ヒューズ(PTC)が電流を減らすか、または完全に遮断するでしょう。この問題を修正するにはVBUSピンでの消費電流を減らしてください。

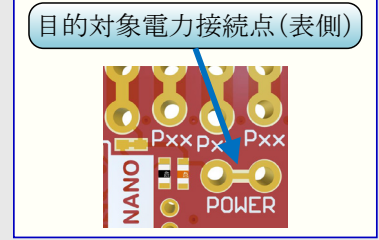
## 3.4. 低電力測定

ATtiny3217への電力はシルク スクリーンで”POWER”と記された100milピンのヘッダ(J101)を通して基板上電源とVTGピンから接続されます。ATtiny3217と基板に接続された他の周辺機能の消費電力を測定するには**目的対象電力切断帯(Power)**を切断して切断帯に渡って電流計を接続してください。

可能な最低消費電力を測定するにはこれらの手順に従ってください。

1. 鋭利な工具で**POWER**切断帯を切断してください。
2. 配置パターンに1×2 100milピン ヘッダを半田付けしてください。
3. ピンヘッダに電流計を繋げてください。
4. 次のようなファームウェアを作ってください。
  - 4.1. 基板上デバッグに接続されるどの入出力もHi-Z(トライステート)にしてください。
  - 4.2. マイクロ コントローラを最低電力の休止状態に設定してください。
5. このファームウェアをATtiny3217に書き込んでください。

図3-7. 目的対象電力接続点



**助言:** 電流計の容易な接続のために**目的対象電力切断帯(J101)**配置パターンに100milピン ヘッダを半田付けすることができます。一旦もはや電流計が必要とされなくなれば、このピンヘッダに短絡ジャンパを置いてください。

**情報:** 基板上の水準変換器は例えそれらが不使用の時でも少量の電流を引き込みます。水準変換器に接続される各入出力ピンから最大2μAで合計10μA引き込むかもしれません。どの漏れも防ぐため、水準変換器に接続されるどの入出力ピンもHi-Z(トライステート)に保ってください。基板上デバッグに接続される全ての入出力は「4.2.4.1. 基板上デバッグ接続」項で一覧にされます。基板上の水準変換器に対するどの漏れも防ぐため、「7.4. 基板上デバッグ切断」で記述されるように、それらを完全に切断することができます。

## 3.5. 外部マイクロ コントローラ書き込み

ATtiny3217 Curiosity Nanoの基板上デバッグは外部ハードウェア上のマイクロ コントローラの書き込みとデバッグに使うことができます。

### 3.5.1. 支援デバイス

Atmel Studioと基板上デバッグでUPDIインターフェースを持つ全ての外部AVRマイクロ コントローラに書き込んでデバッグすることができます。

Atmel Studioと基板上デバッグでCuriosity Nano基板を持つ外部SAMマイクロ コントローラに書き込んでデバッグすることができます。

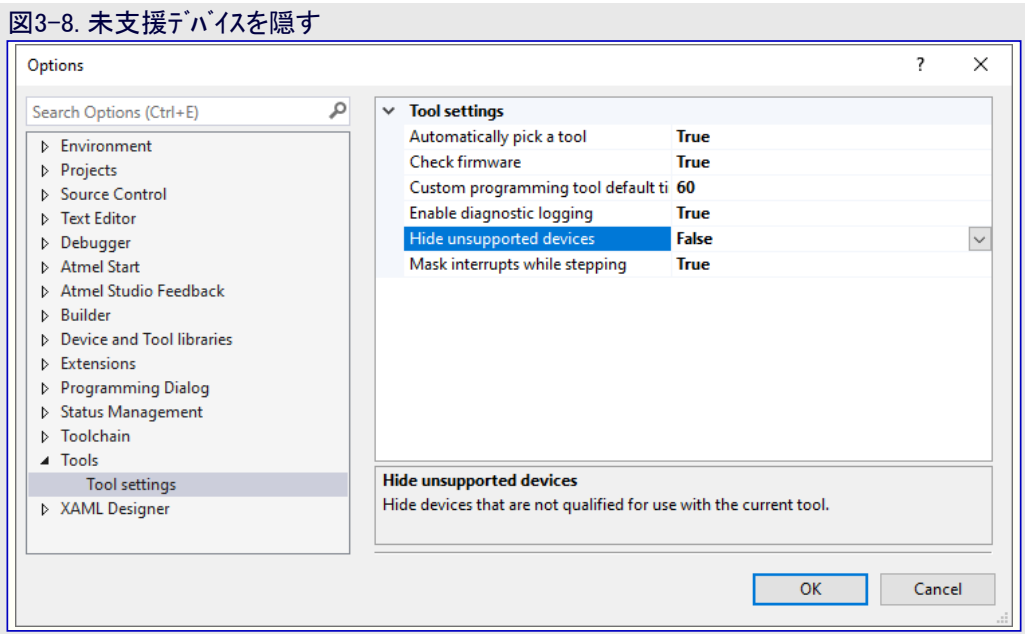
ATtiny3217 Curiosity NanoはMPLAB X IDEで外部ATtiny3217マイクロ コントローラに書き込んでデバッグすることができます。

### 3.5.2. ソフトウェア構成設定

基板上に実装された同じデバイスに書き込んでデバッグするのにソフトウェア構成設定は必要とされません。

基板上に実装されたのと違うマイクロ コントローラに書き込んでデバッグするには、Atmel Studioがデバイスとプログラム インターフェースの自由な選択を許すように構成設定されなければなりません。

1. 応用上部のメニュー システムを通して**Tools(ツール)⇒Options(任意選択)**へ誘導してください。
2. Options(任意選択)ウィンドウで**Tools(ツール)⇒Tool settings(ツール設定)**区分を選んでください。
3. **Hide unsupported devices(未支援デバイスを隠す)**任意選択を**False(偽)**に設定してください。



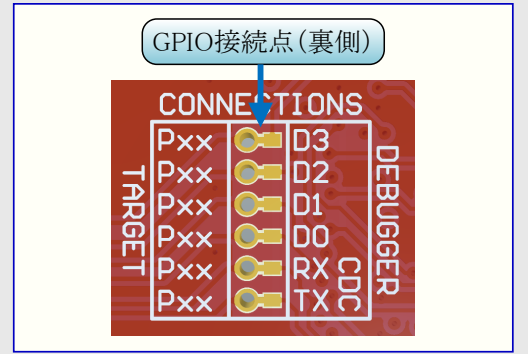


**情報:** Atmel StudioはHide unsupported devices(未支援デバイスを隠す)がFalse(偽)に設定されると、基板上デバグによって支援されないマイクロ コントローラとインターフェースも含め、どのマイクロ コントローラとインターフェースも選ばれることを許します。

### 3.5.3. ハードウェア変更

基板上デバグは既定でATtiny3217に接続されます。これらの接続はどの外部マイクロ コントローラも書き込みまたはデバグされる得るのに先立って取り去られなければなりません。基板上デバグからATtiny3217を切断するには鋭利な工具で右図で示されるGPIO切断帯を切断してください。

図3-9. デバグへの書き込みとデバグの接続



**情報:** デバグへの接続の切断は基板上に実装されたATtiny3217の書き込み、デバグ、データ流しを禁止します。

**助言:** 基板上デバグとATtiny3217間の信号を再接続するには配置パターンに渡って0Ω抵抗を半田付けするか、または半田でそれらを短絡回路にしてください。

### 3.5.4. 外部マイクロ コントローラへの接続

下の図と表は外部マイクロ コントローラに書き込んでデバグするために書き込みとデバグの信号が接続されなければならない場所を示します。基板上デバグは外部ハードウェアに電力を供給するか、またはその水準変換器用の参照基準として外部電圧を使うことができます。「3.3. 電源」で電源についてもっとお読みください。

基板上デバグと水準変換器は書き込みとデバグに使われるデータとクロックの信号(DBG0、DBG1、DBG2)を積極的に駆動し、殆どの場合でこれらの信号上の外部抵抗を無視することができます。PIC®マイクロ コントローラをデバグするのにICSP™のデータとクロックの信号にプルダウン抵抗が必要とされます。

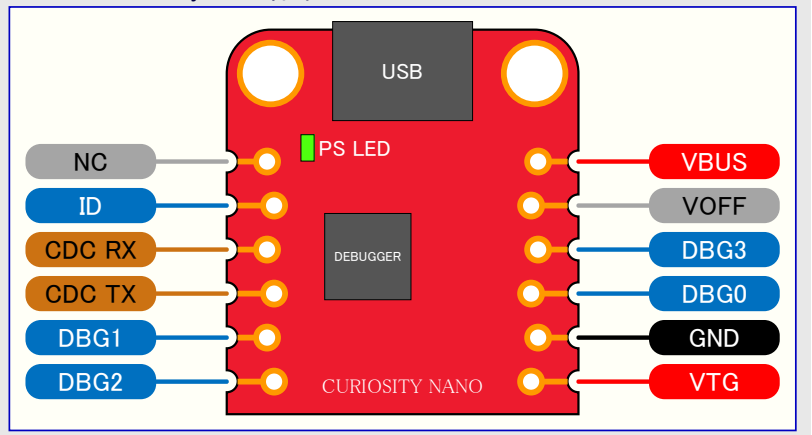
DBG3は開放ドレイン接続で、機能するのにプルアップ抵抗を必要とします。

- 留意:**
- ・ GNDとVTGを外部マイクロ コントローラに接続してください。
  - ・ 外部ハードウェアがそれ自身の電源を持つ場合、VOFFピンをGNDに繋げてください。
  - ・ PICマイクロ コントローラのデバグを支援するにはICSPのデータとクロックの信号(DBG0とDBG1)にプルダウン抵抗があることを確実にしてください。

表3-4. プログラム/デバグ インターフェース

Curiosity Nanoピン	UPDI	ICSP™	SWD
DBG0	UPDI	DATA	SWDIO
DBG1	—	CLK	SWCLK
DBG2	—	—	—
DBG3	—	#MCLR	#RESET

図3-10. Curiosity Nano標準ピン配列



### 3.6. 外部デバッグ接続

基板上デバッグがあるとは言え、ATtiny3217の書き込みとデバッグのためにATtiny3217 Curiosity Nanoに外部デバッグを直接的に接続することができます。基板上デバッグは積極的に使われない時にATtiny3217と基板端に接続された全てのピンをHi-Zに保ちます。従って、基板上デバッグはどの外部デバッグ ツールにも干渉しません。

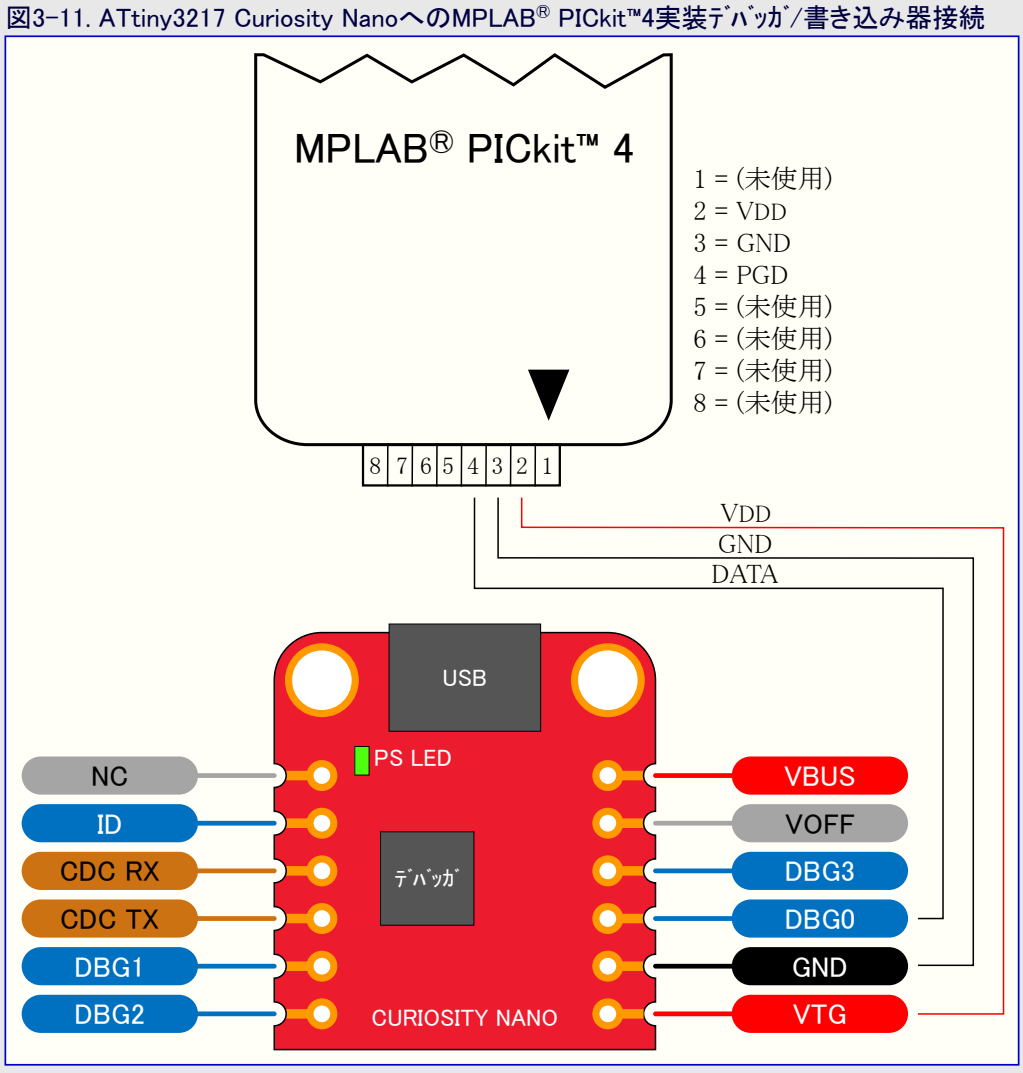
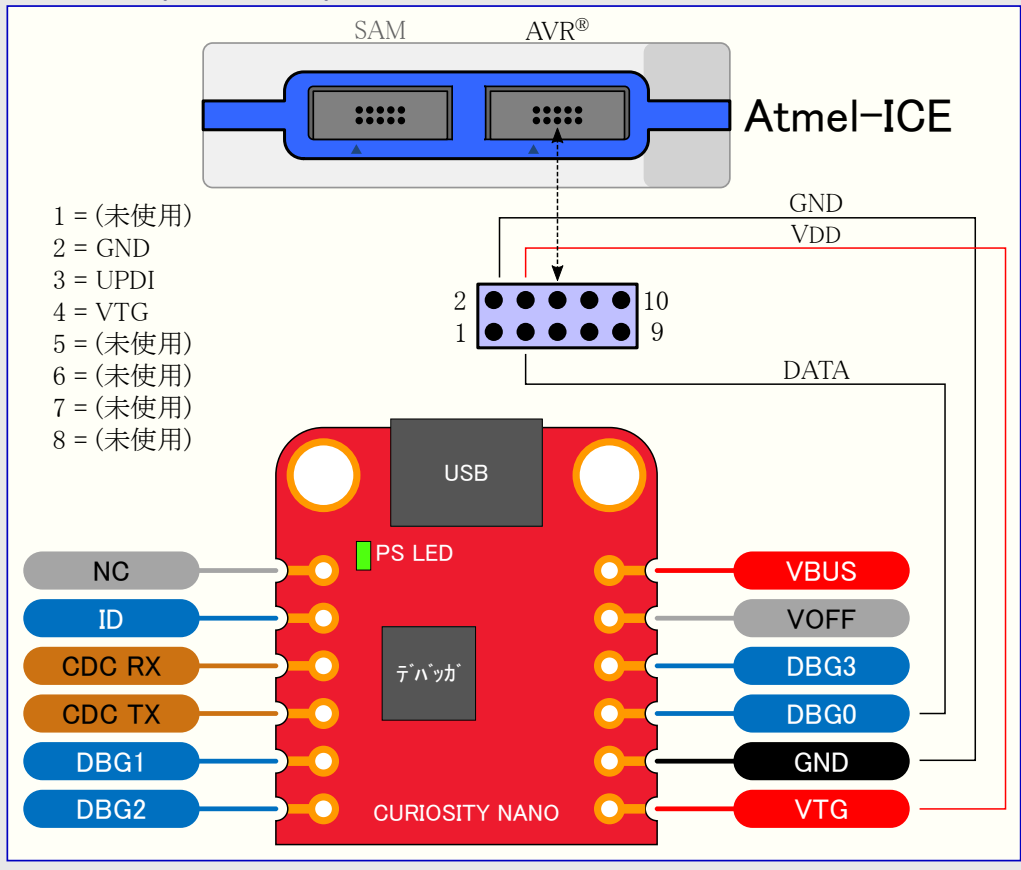


図3-12. ATtiny3217 Curiosity NanoへのAtmel-ICE接続



外部デバッガと基板上デバッガ間の競合を避けるため、外部ツールが活性な間にAtmel Studio/Microchip® X IDEを通す基板上デバッガでのどの書き込み/デバッグの操作開始や大容量記憶の書き込みを行わないでください。

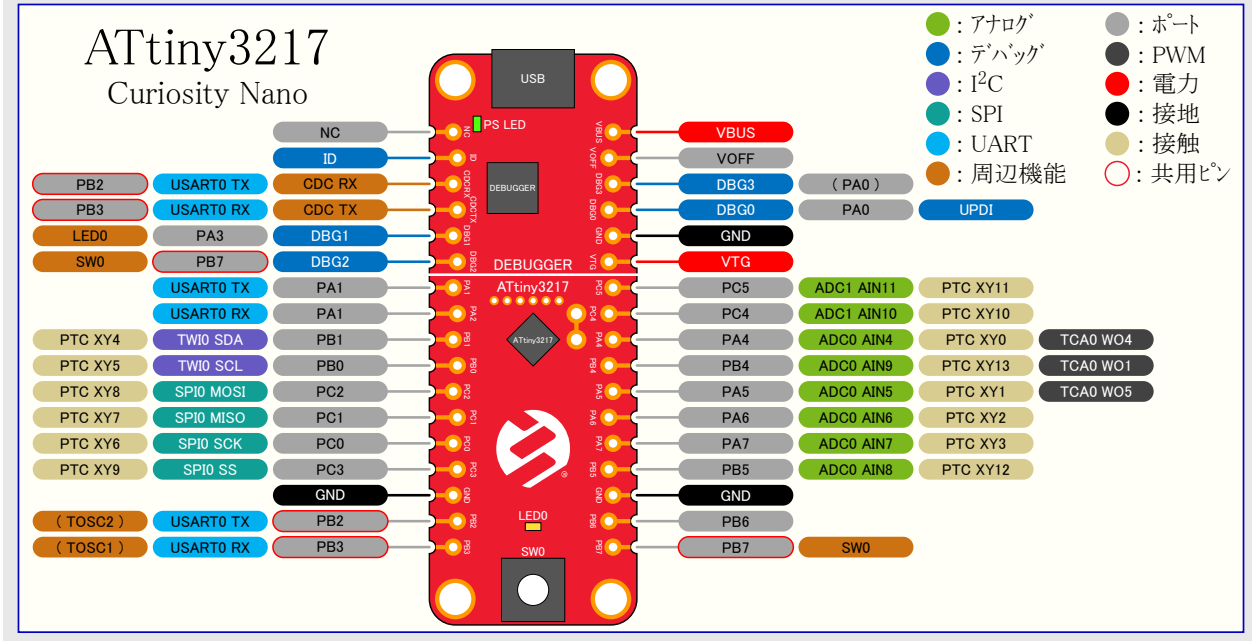
## 4. ハードウェア使用者の手引き

### 4.1. コネクタ

#### 4.1.1. ATtiny3217 Curiosity Nanoピン配列

全てのATtiny3217入出力ピンは基板上の端コネクタでアクセス可能です。下の画像は基板のピン配列を示します。各ピンで利用可能な機能についてはATtiny3217データシートの「入出力多重化と考察」章を参照してください。

図4-1. ATtiny3217 Curiosity Nanoピン配列



#### 4.1.2. ピン ヘッドの使い方

ATtiny3217 Curiosity Nanoの端コネクタ配線パターンは各穴が中心から8mil(約0.2mm)外れた千鳥足設計を持ちます。この穴ずれは半田付けすることなく基板上で通常の100milピン ヘッドの使用を許します。一旦ピン ヘッドがしっかりと所定位置に配置されると、それらは通常的应用で何の問題もなくピン ソケットと試作基板のように使うことができます。

**助言:** ピン ヘッドの一端から開始し、基板の長手に沿ってヘッドを徐々に挿入してください。一旦全てのピンが所定位置に置かれたなら、それらを幅広く押すのに平面を使ってください。

**助言:** ピン ヘッドが定常的に使われる応用については未だそれらを所定位置に半田付けすることが推奨されます。

**重要:** 一旦ピン ヘッドが所定位置に置かれると、それらは手で取り外すのが難しくなります。ピン ヘッドとPCBへの損傷を避けるため、1組のペンチを使ってピン ヘッドを注意深く取り外してください。

### 4.2. 周辺機能

#### 4.2.1. LED

GPIOかPWMのどちらかによって制御することができるATtiny3217 Curiosity Nano基板上で利用可能な1つの黄色の使用者LEDがあります。LEDは接続された入出力線をGNDに駆動することによって活性に(点灯)することができます。

表4-1. LED接続

ATtiny3217ピン	機能	共用機能
PA3	黄色LED0	端コネクタ, 基板上デバッグ

#### 4.2.2. 機械的な切替器

ATtiny3217 Curiosity Nanoは1つの機械的な切替器を持ちます。これは一般的な使用者切替器です。切替器が押されると、その入出力線を接地(GND)に駆動します。

表4-2. 機械的な切替器

ATtiny3217ピン	説明	共用機能
PB7	使用者切替器(SW0)	端コネクタ, 基板上デバッグ

**情報:** 切替器に接続される外部的な抵抗器はありません。切替器を使うにはPB7ピンで内部プルアップが許可されることを確実にしてください。



## 4.2.3. クリスタル

ATtiny3217 Curiosity Nano基板は2つの端子を持ち1.5mm面実装による標準3.2mm用に作られた32.768kHzクリスタル実装パターンを持ちます。

GPIOが端コネクタに配線されているため、クリスタル実装パターンは既定でATtiny3217に接続されていません。クリスタルを使うにはいくつかのハードウェア変更が必要とされます。端コネクタに配線された2つの入出力線はクリスタルへの競合の可能性を減らすのと、線上の過大な容量を取り去るために切断されなければなりません。これは下図で示されるようにPB2とPB3と記された基板の裏側の2つの切断帯を切ることによって行われます。次に、基板の表側でクリスタル傍らの丸い半田点の各々円を短絡してください。最も簡単な方法はパターンを繋ぐ半田滴で半田付けすることです。

7pFの等価負荷容量と70kΩのESRを持つクリスタル(XC200)と1つの10pF外部整合容量(C203)及び1つの13pF外部整合容量(C204)はこの基板で良好な結果をもたらすことが検査されています。実装パターン位置については「7.2. 組立図」をご覧ください。

図4-2. クリスタル接続と切断帯

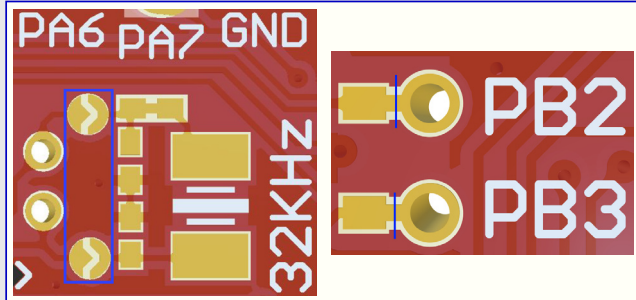


表4-3. クリスタル接続

ATtiny3217	機能	共用機能
PB3	TOSC1(クリスタル入力)	端コネクタ
PB2	TOSC2(クリスタル出力)	端コネクタ

## 4.2.4. 基板上デバッグ実装

ATtiny3217 Curiosity NanoはUPDIを使うATtiny3217の書き込みとデバッグに使うことができる基板上デバッグが特徴です。基板上デバッグはUART上仮想シリアルポート(CDC)インターフェースとデバッグGPIOも含まれます。書き込みとデバッグのための基板上デバッグ用前処理部としてAtmel Studio/Microchip MPLAB® X IDEを使うことができます。CDCとデバッグGPIO用前処理部としてMPLABデータ可視器(Data Visualizer)を使うことができます。

### 4.2.4.1. 基板上デバッグ接続

下表は目的対象とデバッグ部分間の接続を示します。目的対象とデバッグ間の全ての接続はデバッグが積極的にインターフェースを使っていない限りHi-Zにされます。従って、小さな信号の混入があるだけなので、ピンは使用者が望むどれにも構成設定することができます。

基板上デバッグの能力をどう使うかの更なる情報については「3.1. 基板上デバッグ概要」をご覧ください。

表4-4. 基板上デバッグ接続

ATtiny3217ピン	デバッグピン	機能	共有機能
PB3	CDC TX	UART RX (ATtiny3217 RX線)	端コネクタ
PB2	CDC RX	UART TX (ATtiny3217 TX線)	端コネクタ
PA0	DBG0	UPDI	端コネクタ
PA3	DBG1	GPIO1	端コネクタ
PB7	DBG2	GPIO0	端コネクタ
(PA0)	DBG3	RESET (J202は既定で未接続)	端コネクタ

## 5. ハードウェア改訂履歴と既知の問題

この使用者の手引きは基板の入手可能な最新版についての情報を提供するように書かれています。以下の項は既知の問題、旧版の改訂履歴、旧版が最新版とどう違うのかについての情報を含みます。

### 5.1. 製品IDと改訂の識別

ATtiny3217 Curiosity Nano基板の改訂と製品識別子は2つの方法、Atmel Studio/MPLAB® X IDEのキット ウィンドウ利用して、またはPCBの裏側の張り紙を見ることによってのどちらかで見つけることができます。

Atmel Studio/MPLAB® X IDEが走行しているコンピュータにATtiny3217 Curiosity Nanoを接続することにより、キット ウィンドウが飛び出します。キット詳細下で一覧にされる通番の最初の6桁が製品識別子と改訂を含みます。



**助言:** キット ウィンドウはMPLAB® X IDEでメニュー バーの**Windows**(ウィンドウ)⇒**Kit Windows**(キット ウィンドウ)を通して開くことができます。

同じ情報はPCBの裏側の張り紙で見つけることができます。殆どの基板はA09-**nnnnrr**として平文で識別子と改訂を持つ張り紙を持ち、ここでの”**nnnn**”は識別子で、”**rr**”は改訂です。制限された空間の基板は製品識別子、改訂、通番文字列を含むDataMatrix符号だけの張り紙を持ちます。

通番文字列は以下の形式を持ちます。

“**nnnnrr**ssssssss”  
**n** = 製品識別子  
**r** = 改訂  
**s** = 通番

ATtiny3217 Curiosity Nano用の製品識別子はA09-3333です。

### 5.2. 改訂2

改訂2は初回公開版です。

## 6. 文書改訂履歴

文書改訂	日付	注釈
A	2020年3月	初版文書公開

## 7. 追補

### 7.1. 回路図

図7-1. ATtiny3217 Curiosity Nano回路図 (1/2)

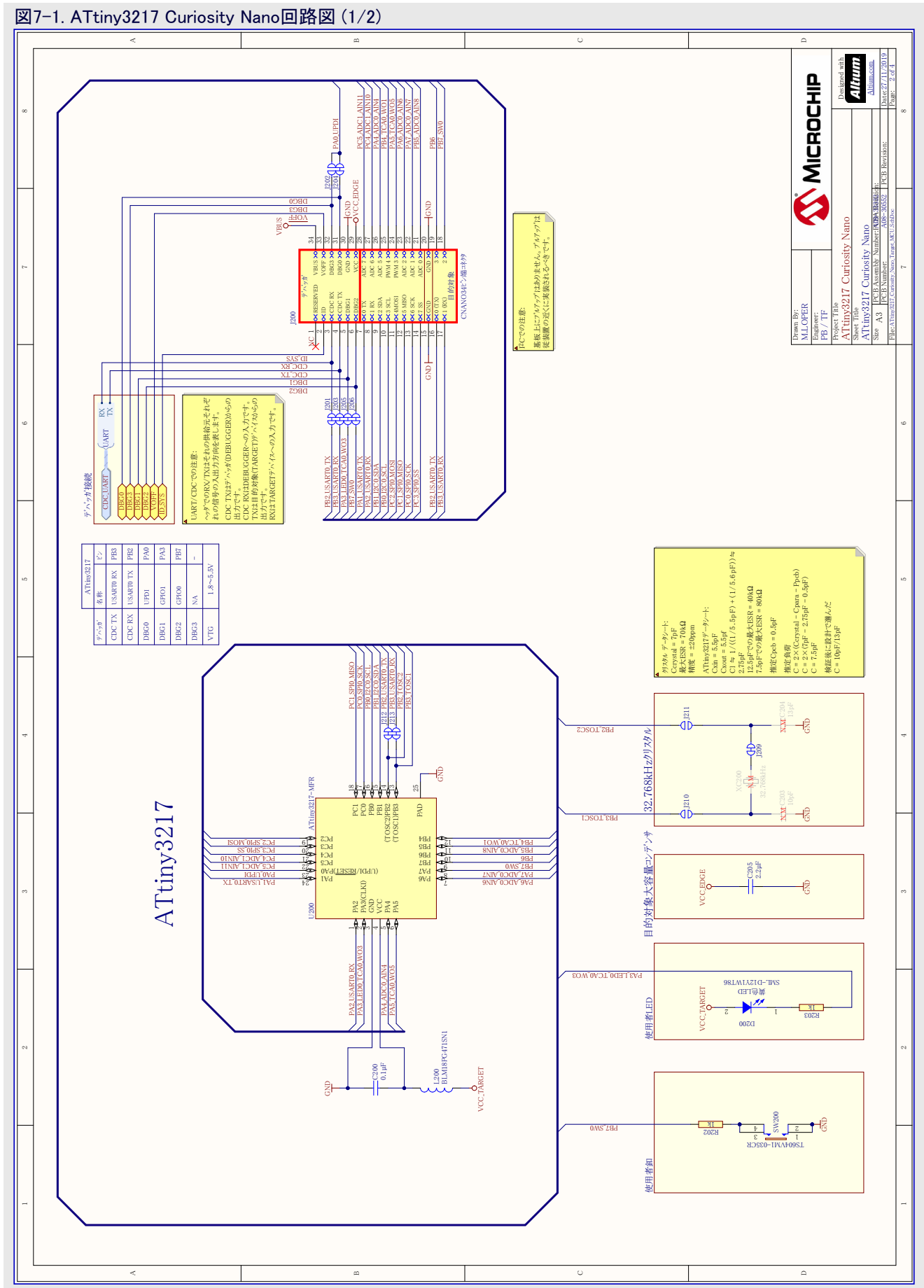
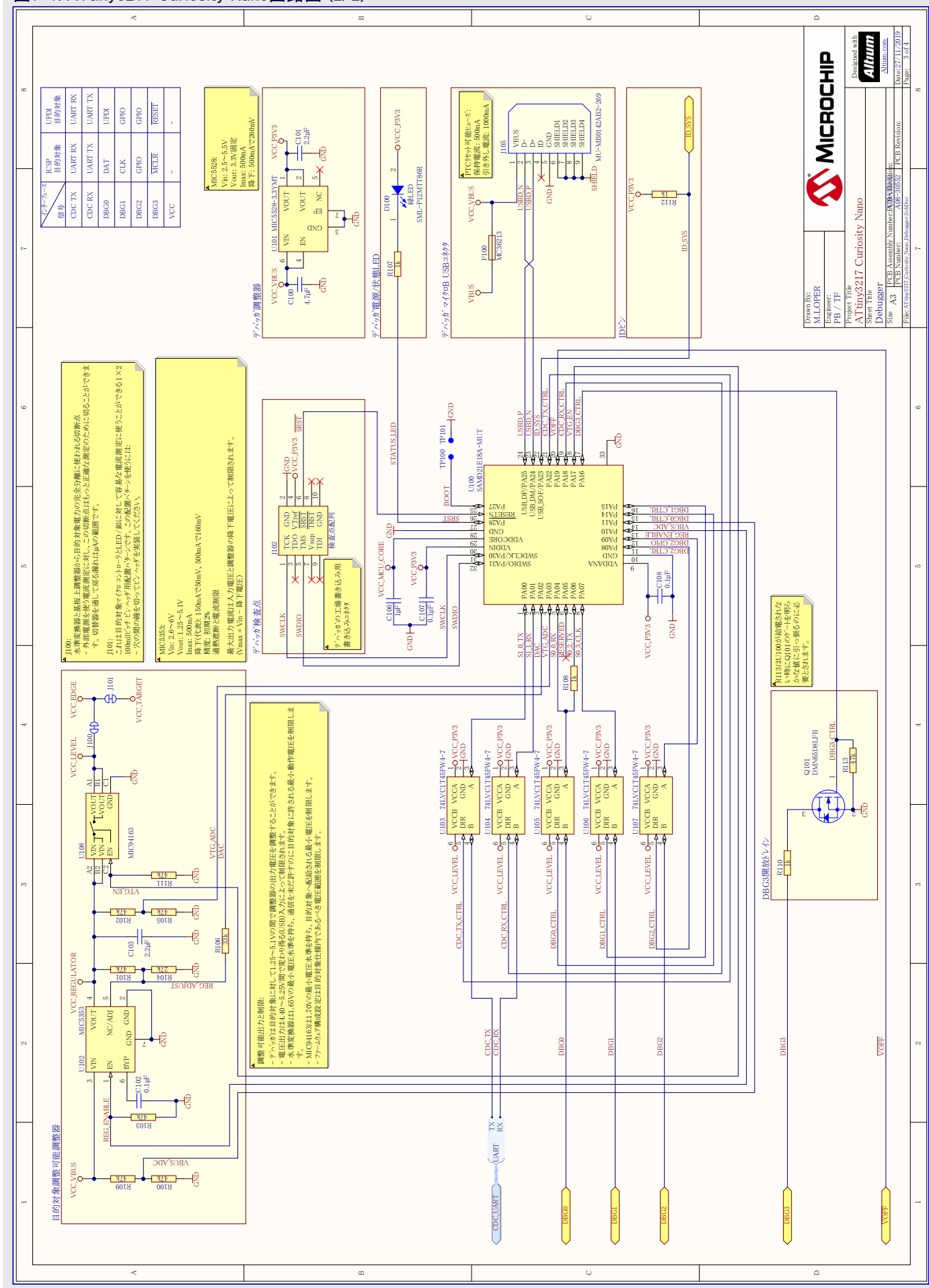


图7-1. ATtiny3217 Curiosity Nano回路图 (2/2)

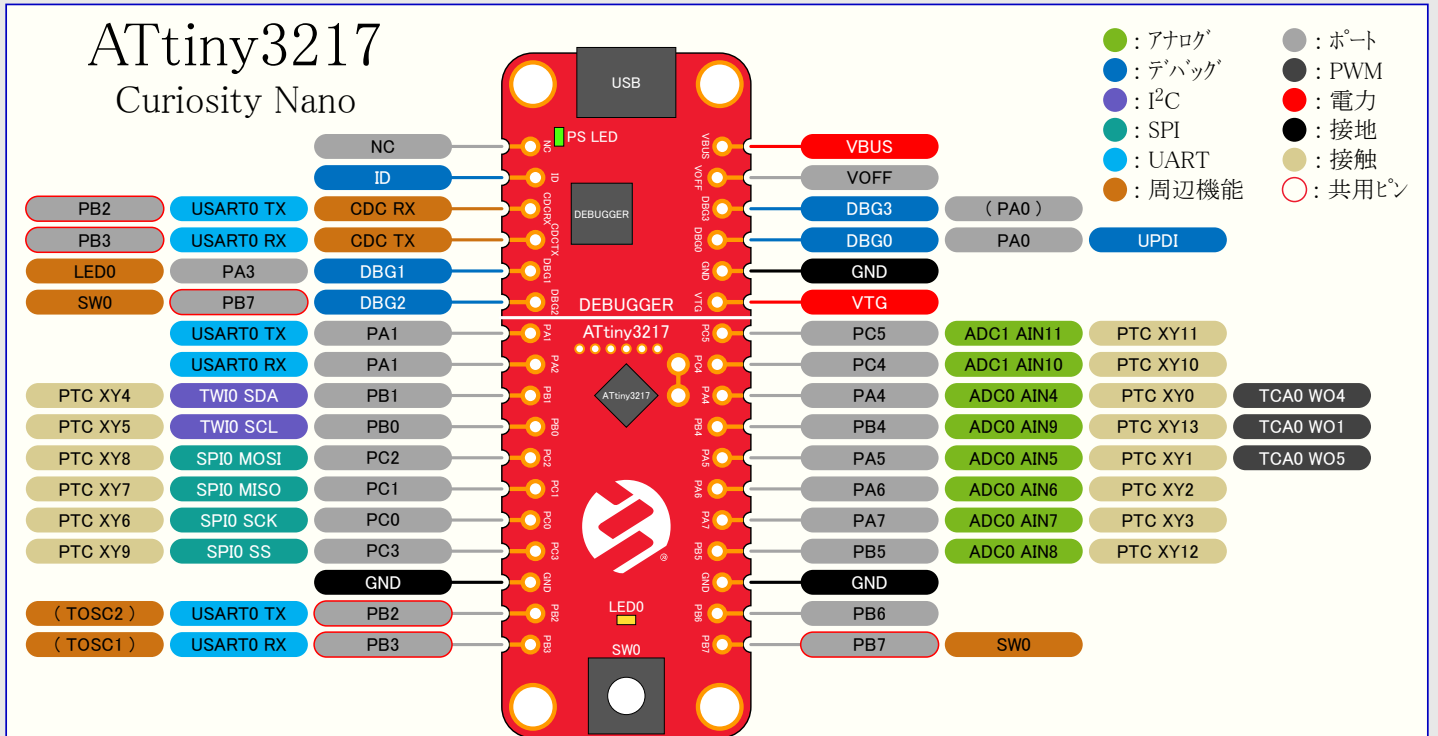




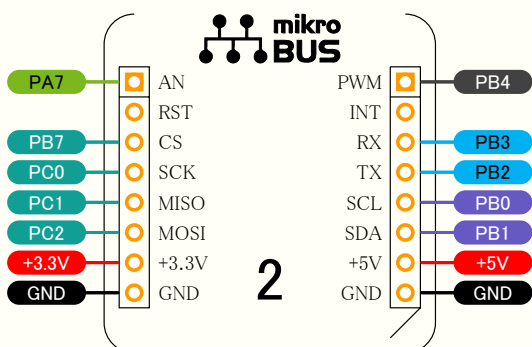
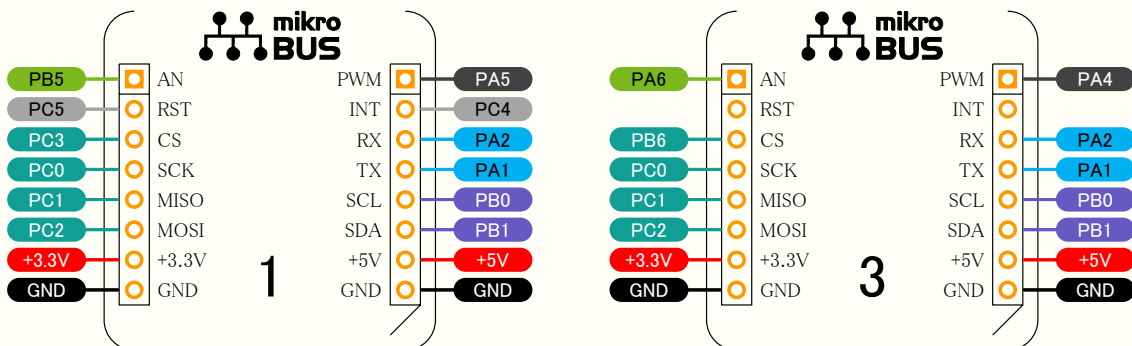


## 7.3. Click boards™用Curiosity Nano基部

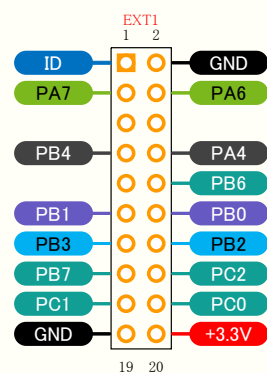
図7-4. ATtiny3217 Curiosity Nanoピン配列割り当て



## click boards™用 Curiosity Nano Base



## Xplained Pro拡張



## 7.4. 基板上デバッグ切断

基板上デバッグと水準変換器はATtiny3217から完全に切断することができます。

下の構成図はデバッグとATtiny3217マイクロコントローラ間の全ての接続を示します。長円形は基板端への接続を表します。示される信号名は基板の裏側でシルクスクリーンでも印刷されます。

デバッグを切断するには図7-6.で示される切断帯を切ってください。

**注意:** 基板上デバッグに対するGPIO切断帯の切断は仮想シリアルポート、書き込み、デバッグ、データ流しを禁止します。電力切断帯の切断は基板上電源を切断します。

**助言:** 切ったどの接続も半田を使って再接続することができ、代わりに0402の0Ω抵抗を実装することもできます。

**助言:** デバッグが切断されると、図7-6.で示される穴に外部デバッグを接続することができます。外部デバッグ接続についての詳細は「3.6. 外部デバッグ接続」で記述されます。

図7-5. 基板上デバッグ接続構成図

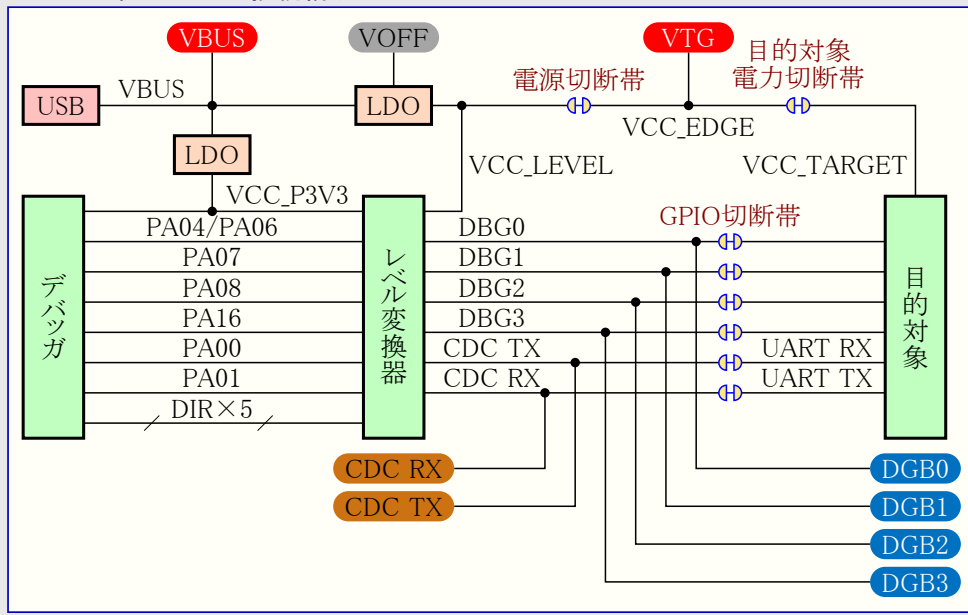
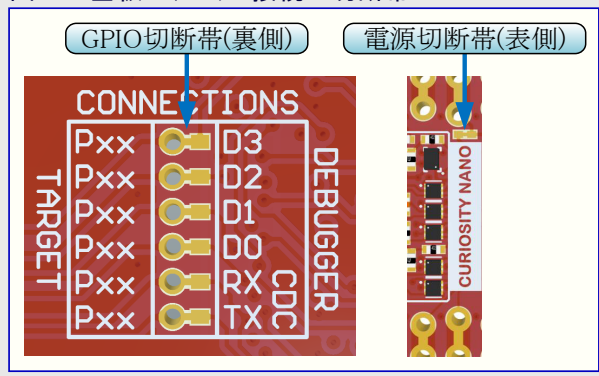


図7-6. 基板上デバッグ接続の切断帯



## 7.5. IARでとの開始に際して

AVR®用IAR Embedded Workbench®はGCCに基づかない専売の高効率コンパイラです。ATtiny3217 Curiosity Nanoの書き込みとデバッグはAtmel-ICEインターフェースを使ってAVR用IAR™ Embedded Workbenchで支援されます。書き込みとデバッグの作業を始めるにはプロジェクトでいくつかの初期設定が構成設定されなければなりません。

以下の手順は書き込みとデバッグのためにプロジェクトの準備を整える方法を説明します。

1. 構成設定を望むプロジェクトを開くことを確実にしてください。プロジェクトに対して**OPTIONS**ダイアログを開いてください。
2. **General Options**区分で、**Target**タブを選んでください。プロジェクト用のデバイス、または一覧になれば、**図7-7**で示されるようにデバイスのコアを選んでください。
3. **Debugger**区部で、**Setup**タブを選んでください。**図7-8**で示されるようにドライバとして**Atmel-ICE**を選んでください。
4. **Debugger**⇒**Atmel-ICE**区部で、**Atmel-ICE 1**タブを選んでください。**図7-9**で示されるようにインターフェースとして**UPDI**を選び、任意選択で**UPDI**周波数を選んでください。

**情報:** (段階4. で言及した)デバッグ ポートの選択が灰色で操作不可の場合、インターフェースが予め選ばれており、この構成設定段階を飛ばすことができます。

図7-7. 目的対象デバイス選択

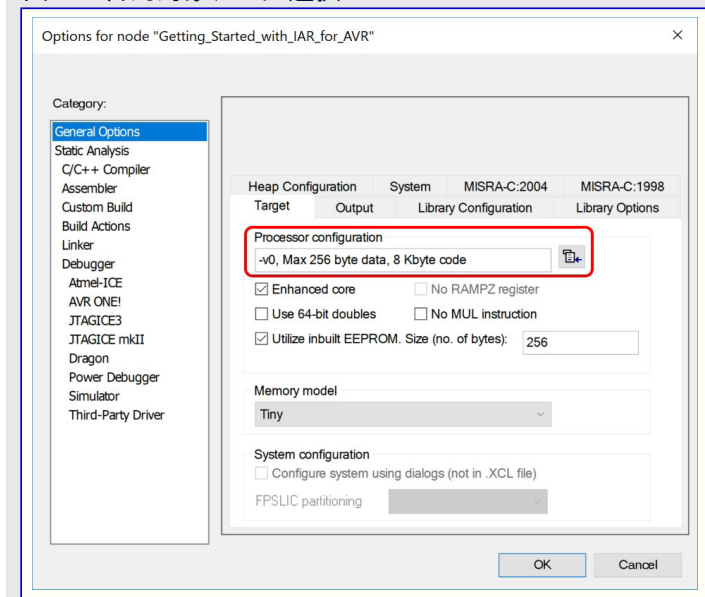


図7-8. デバッグ選択

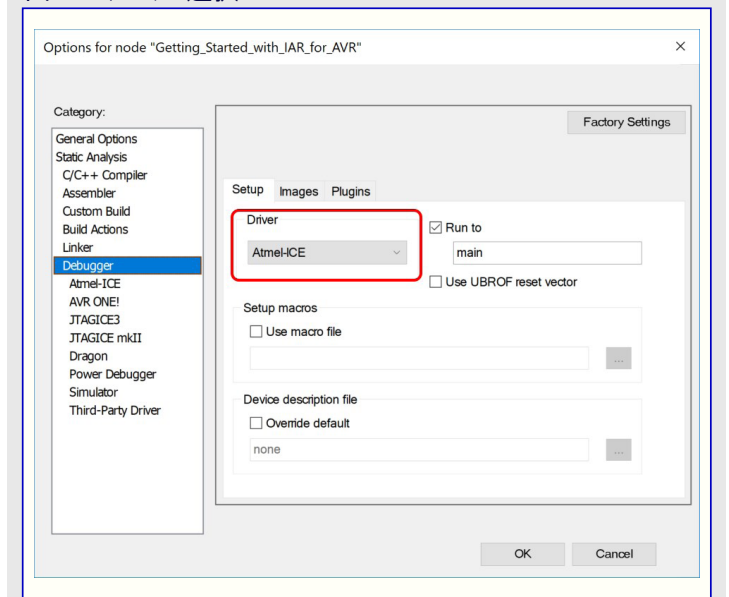
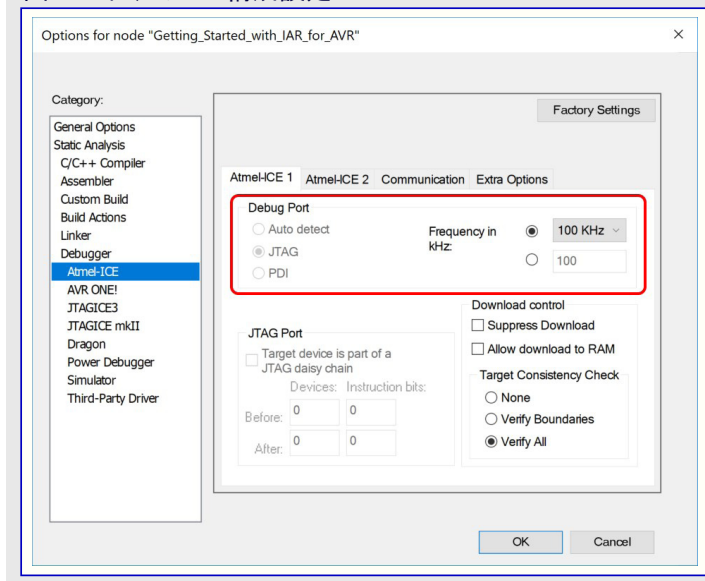


図7-9. インターフェース構成設定





## Microchipウェブ サイト

Microchipは<http://www.microchip.com/>で当社のウェブ サイト経由でのオンライン支援を提供します。このウェブ サイトはお客様がファイルや情報を容易に利用可能にするのに使われます。利用可能な情報のいくつかは以下を含みます。

- ・ **製品支援** – データシートと障害情報、応用記述と試供プログラム、設計資源、使用者の手引きとハードウェア支援資料、最新ソフトウェア配布と保管されたソフトウェア
- ・ **全般的な技術支援** – 良くある質問(FAQ)、技術支援要求、オンライン検討グループ、Microchip設計協力課程会員一覧
- ・ **Microchipの事業** – 製品選択器と注文の手引き、最新Microchip報道発表、セミナーとイベントの一覧、Microchip営業所の一覧、代理店と代表する工場

## 製品変更通知サービス

Microchipの製品変更通知サービスはMicrochip製品を最新に保つのに役立ちます。加入者は指定した製品系統や興味のある開発ツールに関連する変更、更新、改訂、障害情報がある場合に必ず電子メール通知を受け取ります。

登録するには<http://www.microchip.com/pcn>へ行って登録指示に従ってください。

## お客様支援

Microchip製品の使用者は以下のいくつかのチャネルを通して支援を受け取ることができます。

- ・ 代理店または販売会社
- ・ 最寄りの営業所
- ・ 組み込み解決技術者(ESE:Embedded Solutions Engineer)
- ・ 技術支援

お客様は支援に関してこれらの代理店、販売会社、またはESEに連絡を取るべきです。最寄りの営業所もお客様の手助けに利用できます。営業所と位置の一覧はこの資料の後ろに含まれます。

技術支援は<http://www.microchip.com/support>でのウェブ サイトを通して利用できます。

## Microchipデバイス コード保護機能

Microchipデバイスでの以下のコード保護機能の詳細に注意してください。

- ・ Microchip製品はそれら特定のMicrochipデータシートに含まれる仕様に合致します。
- ・ Microchipは意図した方法と通常条件下で使われる時に、その製品系統が今日の市場でその種類の最も安全な系統の1つであると考えます。
- ・ コード保護機能を破るのに使われる不正でおそらく違法な方法があります。当社の知る限りこれらの方法の全てはMicrochipのデータシートに含まれた動作仕様外の方法でMicrochip製品を使うことが必要です。おそらく、それを行う人は知的財産の窃盗に関与しています。
- ・ Microchipはそれらのコードの完全性について心配されているお客様と共に働きたいと思います。
- ・ Microchipや他のどの半導体製造業者もそれらのコードの安全を保証することはできません。コード保護は当社が製品を”破ることができない”として保証すると言うことを意味しません。

コード保護は常に進化しています。Microchipは当社製品のコード保護機能を継続的に改善することを約束します。Microchipのコード保護機能を破る試みはデジタル ミレニアム著作権法に違反するかもしれません。そのような行為があなたのソフトウェアや他の著作物に不正なアクセスを許す場合、その法律下の救済のために訴権を持つかもしれません。

## 法的通知

デバイス応用などに関してこの刊行物に含まれる情報は皆さまの便宜のためにだけ提供され、更新によって取り換えられるかもしれません。皆さまの応用が皆さまの仕様に合致するのを保証するのは皆さまの責任です。**Microchipはその条件、品質、性能、商品性、目的適合性を含め、明示的にも黙示的にもその情報に関連して書面または表記された書面または黙示の如何なる表明や保証もしません。**Microchipはこの情報とそれの使用から生じる全責任を否認します。生命維持や安全応用でのMicrochipデバイスの使用は完全に購入者の危険性で、購入者はそのような使用に起因する全ての損害、請求、訴訟、費用からMicrochipを擁護し、補償し、免責にすることに同意します。他に言及されない限り、Microchipのどの知的財産権下でも暗黙的または違う方法で許認可は譲渡されません。

## 商標

Microchipの名前とロゴ、Microchipロゴ、Adaptec、AnyRate、AVR、AVRロゴ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、chipKIT、chipKITロゴ、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、FlashFlex、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemiロゴ、MOST、MOSTロゴ、MPLAB、OptoLyzer、PacTime、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32ロゴ、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SSTロゴ、SuperFlash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TempTracker、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron、XMEGAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

APT、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、FlashTec、Hyper Speed Control、HyperLight Load、IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plusロゴ、Quiet-Wire、SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、Vite、WinPath、ZLは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、BlueSky、BodyCom、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、EtherGREEN、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICnet、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、KleerNet、KleerNetロゴ、memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certifiedロゴ、MPLAB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REALICE、Ripple Blocker、SAM-ICE、Serial Quad I/O、SMART-I.S.、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、View Sense、WiperLock、Wireless DNA、ZENAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの商標です。

SQTPは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの役務標章です。

Adaptecロゴ、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology、Symmcomは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の登録商標です。

GestICは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の子会社であるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. KGの登録商標です。

ここで言及した以外の全ての商標はそれら各々の会社の所有物です。

© 2020年、Microchip Technology Incorporated、米国印刷、不許複製

## 品質管理システム

Microchipの品質管理システムに関する情報については<http://www.microchip.com/quality>を訪ねてください。

日本語© HERO 2022.

本使用者の手引きはMicrochipのATtiny3217 Curiosity Nano使用者の手引き(DS50002193A-2020年3月)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意識されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には( )内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。

## 世界的な販売とサービス

米国	亜細亜/太平洋	亜細亜/太平洋	欧州
<b>本社</b> 2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199 Tel: 480-792-7200 Fax: 480-792-7277 技術支援: <a href="http://www.microchip.com/support">http://www.microchip.com/support</a> ウェブアドレス: <a href="http://www.microchip.com">http://www.microchip.com</a> <b>アトランタ</b> Duluth, GA Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455 <b>オースチン TX</b> Tel: 512-257-3370 <b>ボストン</b> Westborough, MA Tel: 774-760-0087 Fax: 774-760-0088 <b>シカゴ</b> Itasca, IL Tel: 630-285-0071 Fax: 630-285-0075 <b>ダラス</b> Addison, TX Tel: 972-818-7423 Fax: 972-818-2924 <b>デトロイト</b> Novi, MI Tel: 248-848-4000 <b>ヒューストン TX</b> Tel: 281-894-5983 <b>インディアナポリス</b> Noblesville, IN Tel: 317-773-8323 Fax: 317-773-5453 Tel: 317-536-2380 <b>ロサンゼルス</b> Mission Viejo, CA Tel: 949-462-9523 Fax: 949-462-9608 Tel: 951-273-7800 <b>ローリー NC</b> Tel: 919-844-7510 <b>ニューヨーク NY</b> Tel: 631-435-6000 <b>サンホセ CA</b> Tel: 408-735-9110 Tel: 408-436-4270 <b>カナダ - トロント</b> Tel: 905-695-1980 Fax: 905-695-2078	<b>オーストラリア - シドニー</b> Tel: 61-2-9868-6733 <b>中国 - 北京</b> Tel: 86-10-8569-7000 <b>中国 - 成都</b> Tel: 86-28-8665-5511 <b>中国 - 重慶</b> Tel: 86-23-8980-9588 <b>中国 - 東莞</b> Tel: 86-769-8702-9880 <b>中国 - 広州</b> Tel: 86-20-8755-8029 <b>中国 - 杭州</b> Tel: 86-571-8792-8115 <b>中国 - 香港特别行政区</b> Tel: 852-2943-5100 <b>中国 - 南京</b> Tel: 86-25-8473-2460 <b>中国 - 青島</b> Tel: 86-532-8502-7355 <b>中国 - 上海</b> Tel: 86-21-3326-8000 <b>中国 - 瀋陽</b> Tel: 86-24-2334-2829 <b>中国 - 深圳</b> Tel: 86-755-8864-2200 <b>中国 - 蘇州</b> Tel: 86-186-6233-1526 <b>中国 - 武漢</b> Tel: 86-27-5980-5300 <b>中国 - 西安</b> Tel: 86-29-8833-7252 <b>中国 - 廈門</b> Tel: 86-592-2388138 <b>中国 - 珠海</b> Tel: 86-756-3210040	<b>インド - ハンガロール</b> Tel: 91-80-3090-4444 <b>インド - ニューデリー</b> Tel: 91-11-4160-8631 <b>インド - プネー</b> Tel: 91-20-4121-0141 <b>日本 - 大阪</b> Tel: 81-6-6152-7160 <b>日本 - 東京</b> Tel: 81-3-6880-3770 <b>韓国 - 大邱</b> Tel: 82-53-744-4301 <b>韓国 - ソウル</b> Tel: 82-2-554-7200 <b>マレーシア - クアラルンプール</b> Tel: 60-3-7651-7906 <b>マレーシア - ペナン</b> Tel: 60-4-227-8870 <b>フィリピン - マニラ</b> Tel: 63-2-634-9065 <b>シンガポール</b> Tel: 65-6334-8870 <b>台湾 - 新竹</b> Tel: 886-3-577-8366 <b>台湾 - 高雄</b> Tel: 886-7-213-7830 <b>台湾 - 台北</b> Tel: 886-2-2508-8600 <b>タイ - バンコク</b> Tel: 66-2-694-1351 <b>ベトナム - ホーチミン</b> Tel: 84-28-5448-2100	<b>オーストラリア - ウェルズ</b> Tel: 43-7242-2244-39 Fax: 43-7242-2244-393 <b>デンマーク - コペンハーゲン</b> Tel: 45-4485-5910 Fax: 45-4485-2829 <b>フィンランド - エスポー</b> Tel: 358-9-4520-820 <b>フランス - パリ</b> Tel: 33-1-69-53-63-20 Fax: 33-1-69-30-90-79 <b>ドイツ - ガルピング</b> Tel: 49-8931-9700 <b>ドイツ - ハーネ</b> Tel: 49-2129-3766400 <b>ドイツ - ハイムブロン</b> Tel: 49-7131-72400 <b>ドイツ - カールスルーエ</b> Tel: 49-721-625370 <b>ドイツ - ミュンヘン</b> Tel: 49-89-627-144-0 Fax: 49-89-627-144-44 <b>ドイツ - ローゼンハイム</b> Tel: 49-8031-354-560 <b>イスラエル - ラーナナ</b> Tel: 972-9-744-7705 <b>イタリア - ミラノ</b> Tel: 39-0331-742611 Fax: 39-0331-466781 <b>イタリア - ハットバ</b> Tel: 39-049-7625286 <b>オランダ - デルフト</b> Tel: 31-416-690399 Fax: 31-416-690340 <b>ノルウェー - トロンハイム</b> Tel: 47-72884388 <b>ポーランド - ワルシャワ</b> Tel: 48-22-3325737 <b>ルーマニア - ブカレスト</b> Tel: 40-21-407-87-50 <b>スペイン - マドリード</b> Tel: 34-91-708-08-90 Fax: 34-91-708-08-91 <b>スウェーデン - イェテボリ</b> Tel: 46-31-704-60-40 <b>スウェーデン - ストックホルム</b> Tel: 46-8-5090-4654 <b>イギリス - ウォーキンガム</b> Tel: 44-118-921-5800 Fax: 44-118-921-5820